PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-073635

(43)Date of publication of application: 17.03.1998

(51)Int.CI.

GO1R 31/26 B25J 15/06 H01L 21/50 H01L 23/32 // H05K 13/02

(21)Application number: 08-248938

(71)Applicant: ANDO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

30.08.1996

(72)Inventor: TAKAGI KENJI

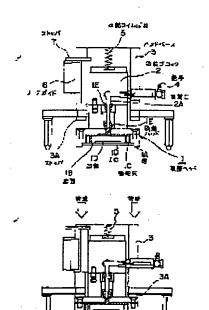
MITSUI HITOSHI

(54) SUCTION HAND FOR BGA PACKAGE IC

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a suction hand by which a BGA(ball grid array) package IC is conveyed by a method wherein a suction head having both a function to suck the IC so as to avoid its center and a function to press the IC so as to avoid its center is mounted on, and attached to, the suction hand so as to be replaceable.

SOLUTION: A suction head 1 is provided with at least one pair of flanges 1A which protrude downward and which are faced with each other, and the outer shape of the package part of an IC 10 is regulated by the flanges 1A. A plurality of fine holes 1C are formed between the flanges 1A in a bottom face 1B which comes into contact with the surface of the package part of the IC 10. In addition, in the suction head 1, a recessed part 1D is formed on the bottom face 1B between the flanges 1A so as to escape from a chip 10A at a BGA package IC. and the plurality of fine holes 1C are formed in the bottom face 1B to be used as the circumference of the



recessed part 1B. The fine holes 1C in the suction head are connected to suction ports in a suction block 2.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.11.1997

[Date of sending the examiner's decision of

02.11.1999

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-73635

(43)公開日 平成10年(1998) 3月17日

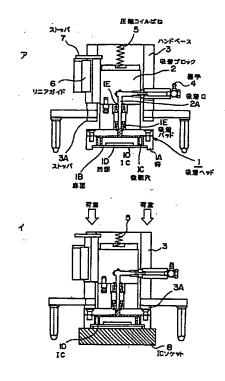
(51) Int.Cl. ⁵	識別記号 庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G01R 31/26		G01R 31/26	Z
B 2 5 J 15/06		B 2 5 J 15/06	D ·
H01L 21/50		H01L 21/50	С
23/32		23/32	В
/ H05K 13/02		H05K 13/02	. Z
·		審査請求 有	請求項の数2 FD (全 5 頁)
(21) 出願番号	特顧平8-248938	(71)出願人 000117	744
		安藤電	気株式会社
(22) 出顧日	平成8年(1996)8月30日	東京都	大田区蒲田4丁目19番7号
		(72)発明者 高木	憲治
		東京都	大田区蒲田4丁目19番7号 安藤電
		気株式	会社内
		(72)発明者 三井	整
		東京都	大田区蒲田4丁目19番7号 安藤電
		気株式	会社内
			•
			•
•			

(54) 【発明の名称】 BGAパッケージIC用吸着ハンド

(57)【要約】

【課題】 表面にチップ10Aの露出するBGAパーケージ形IC10を吸脱着する水平搬送式オートハンドラの吸着ハンドを提供する。

【解決手段】 吸着ヘッド1は、下方に突出して相対向する少なくとも一対の鍔1Aをもち、前記鍔1AでIC10のパッケージ外形を規制する。鍔1A間であってIC10のパッケージ部上面に当接する底面1Bに複数の微細穴1Cを形成する。さらに、吸着ヘッド1は鍔1A間の底面1BにBGAパッケージICのチップ10Aを逃げる形で凹部1Dを形成し、凹部1Bの周囲となる底面1Bに複数の微細穴1Cを形成する。吸着ヘッド1の微細穴1Cが吸着ブロック2の吸着口と接続する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 下方に突出して相対向する少なくとも一 対の鍔(1A)をもち、前記鍔(1A)でIC(10)のパッケージ 外形を規制し、鍔(1A)間であって I C (10)のパッケージ 部上面に当接する底面 (1B) に複数の微細穴 (1C) を形成す る吸着ヘッド(1) を備え、

吸着ヘッド(1) の微細穴(1C)が吸着ブロックの吸着口と 接続することを特徴とするBGAパッケージIC用吸着 ハンド。

【請求項2】 鍔(1A)間の底面(1B)にBGAパッケージ 10 I Cのチップ(10A)を逃げる形で凹部(1D)を形成し、凹 部(1D)の周囲となる底面(1B)に複数の微細穴(1C)を形成 する請求項 1 記載の吸着ヘッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、BGA(Ba 11 Grid Array) パッケージ I C用の吸着ハンドについての ものである。水平搬送式オートハンドラでは、フラット 形パッケージICを吸着ハンドで吸脱着して搬送する。 この発明は、このような水平搬送式オートハンドラにお 20 いて、少なくとも測定部に使用されるBGAバッケージ IC用吸着ハンドについてのものである。

[0002]

【従来の技術】次に、通常のフラット形パッケージIC 用の吸着ハンドの構成を図4により説明する。図4の2 は吸着ブロック、4は継手、5は圧縮コイルばね、6は リニアガイド、7はストッパ、11は吸着ヘッド、13 はハンドベース、14は押圧ブロックである。

【0003】図4において、吸着ヘッド11は吸着ブロ ック2に取り付けられる。吸着ブロックブ2はリニアガ 30 イド6によりハンドベース13とすべり結合しており、 吸着ヘッド11と吸着ブロック2は一体となって、ハン ドベース13に対し移動する。ハンドベース13の下部 には押圧ブロック14が取り付けられる。

【0004】図4アの状態では、吸着ヘッド11と吸着 ブロック2は自重と圧縮コイルばね5の力により下がっ ており、ストッパ7がハンドベース13に当たった状態 で停止している。吸着ヘッド11の中心には2つの吸着 パッド11Aが相反する形で内装されており、一方の吸 着パッド11Aは吸着ヘッド11の底面から微小突出 し、他方の吸着パッド11Aは吸着ブロック2の吸着口 2Aと接続している。

【0005】継手4は図示されない真空源と接続されて おり、空気を吸引すれば吸着ヘッド11の底面にIC2 0を吸着できる。

【0006】図4アの状態で、吸着ハンドをICソケッ ト18上に移動し、下降してICソケット18にIC2 0を押しつける。図4イは【C20を【Cソケット】8 に押しつけた状態図である。 ハンドベース 13の上部か ら荷重が加えられることにより、ハンドベース13から 50 数の微細穴1Cを形成する。

リード押え14AによりIC20のリード20Aが接触 子18Aに押しつけられ、ICテスタにより測定でき

【0007】図4イの状態では、吸着ヘッド11は相対 的に上方へ移動し圧縮コイルばね5を縮め、1020の パッケージ部には、吸着ヘッド11と吸着ブロック2の 自重と圧縮コイルばね5の力が加わるのみであり、リー ド20Aに過負荷がかかるの防いでいる。 測定終了後 は、吸着ヘッド11がIC20を吸着したまま上昇し、 次のICを搬送する準備に入る。

【0008】図5は、図4の吸着ヘッド11と押圧プロ ック14の斜視図である。押圧ブロック14の中心に吸 着ヘッド11の入る穴が抜いてあり、一定の隙間をもっ た状態で、図5の矢印方向に吸着ヘッド11が挿入され る。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】図4において、押圧ブ ロック14は1Cのリードを1Cソケットの接触子に押 圧する機能をもち、吸着ヘッドllはICのパッケージ 部で正確に位置決めして吸着する機能をもつ。

【0010】水平搬送式オートハンドラでは、選別され るICのサイズや形状が変更されると、押圧ブロックと 吸着ヘッドはICの種類に合わせた部品に交換される。 【0011】近年では、表面実装形パッケージのICで 従来のリードのもつフラット形ICに変わり、ICのバ ッケージ裏面に、はんだボールを格子状に配置するBG A (Ball Grid Array) 形パッケージの I Cが採用され ている。さらに、最近ではBGA形パッケージ上面にチ ップが露出しているタイプのICが開発されている。

【0012】従来の吸着ハンドでは、吸着ヘッドの中心 に、吸着パッドが配置されているため、前述のBGA形 I Cを吸着することができない。BGA形 I Cに対応す る吸着ハンドが求められている。

【0013】との発明は、ICの中心を避けて吸着する 機能と、ICの中心を避けて押しつける機能を併せもつ 吸着ヘッドを吸着ハンドに交換可能に装着することによ り、BGA形パッケージICを搬送する吸着ハンドの提 供を目的とする。

[0014]

【課題を解決するための手段】との目的を達成するた め、この発明は、下方に突出して相対向する少なくとも 一対の鍔1Aをもち、前記鍔1AでIC10のパッケー ジ外形を規制し、鍔1A間であってIC10のパッケー ジ部上面に当接する底面1 Bに複数の微細穴1 Cを形成 する吸着ヘッドlを備え、吸着ヘッドlの微細穴lCが 吸着ブロックの吸着□と接続する。

【0015】さらに、吸着ヘッド1は鍔1A間の底面1 BにBGAパッケージICのチップ10Aを逃げる形で 凹部 I Dを形成し、凹部 I Bの周囲となる底面 I Bに複

[0016]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照してこの発明の 一実施の形態を説明する。図1は、この発明による吸着 バンドの一実施の形態による構成図であり、図4に対比 している。なお、以下、図4で用いた同符号の構成品は その機能、作用を同じにするので、特に必要のない限り 説明を省略する。

【0017】図1の1は吸着ヘッド、3はハンドベー ス、10はBGA形のICである。図1アはIC10を 吸着ヘッド1で吸着している状態図である。吸着ヘッド 10 1は吸着ブロック2に取り付けられ、吸着ブロック2は リニアガイド6によりハンドベース3に取り付けられて

【0018】図1アの状態では、吸着ヘッド1と吸着ブ ロック2は自重と圧縮コイルばね5の力により下がって おり、ストッパ7がハンドベース3に当たった状態で停 止している。

【0019】図4では、ハンドベース13に押圧ブロッ ク14が取り付けられていたが、図1ではハンドベース 3にストッパ3Aが取り付けられている。また、図4で 20 は吸着ブロック2に吸着ヘッド11が取り付けられてい たのに対し、図1では吸着ブロブロック2に吸着ヘッド 1が取り付けられている。すなわち、この発明では、こ れらの部品をBGA形ICの交換部品として考えてい る。

【0020】吸着ヘッド1の下部には、下方に突出して 相対向する一対の鍔IAをもつ。この鍔IAでIC10 のパッケージ外形を規制する。 鍔1 A 間の底面1 B は I C10のパッケージ上面に当接し、底面1Bに複数の微 細穴10を形成する。

【0021】底面IBにはIC10のチップ10Aを逃 げる形で凹部 1 Dを形成する。凹部 1 Dの周囲となる底 面1 Cに前記の微細穴1 Cを形成する。

【0022】吸着ヘッド1の上部中心には2つの吸着バ ッド1Eが相反する形で内装されており、一方の吸着バ ッド1 E は吸着ヘッド1の微細穴1 C と接続し、他方の 吸着パッド1Eは吸着ブロック2の吸着口2Aと接続し ている。

【0023】 このため、継手4より空気を吸引すれば、 IC10を吸着することができる。図1アの状態で、吸 40 1A 鍔 着ハンドをICソケット8上に移動し、下降してICソ ケット8に【C10を押しつける。図1イは【C10を ICソケット8に押しつけた状態図である。

【0024】 IC10は、ハンドベース3の上部から荷 重が加えられることにより、ハンドベース3からストッ パ3Aを介して吸着ヘッド1に荷重が伝わり、ICソケ ット8に押しつけられ、ICテスタによる測定ができ る。

【0025】図1イでは、吸着ヘッド1は相対的に上方 へ移動し圧縮コイルばね5を縮めるが、ストッパ3に当 50 7 ストッパ

たり、これ以上、移動しないので、IC10を押しつけ る荷重を十分伝えることができる。

【0026】測定終了後は吸着ヘッド1がIC10を吸 着したまま上昇し、次のICを搬送する準備に入る。

【0027】図2は吸着ヘッド1とIC10の外観図で ある。図2におけるIC10上面のハッチング部は吸着 ヘッド1の吸着面であり、吸着ヘッド1の押圧面でもあ

【0028】IC10の形状、サイズが異なれば、凹部 1 Dと底面 1 Bの形状が対応した吸着ヘッド 1 が吸着ブ ロック2に取り付けられる。なお、図2において、チッ プ10Aが露出しない平坦なBGA形ICであっても、 図2の吸着ヘッド1で吸着できる。

【0029】図3は吸着ヘッド1の吸着面からの外観図 である。図3に示されるように、凹部1Dを除く底面1 Bに複数の微細穴1が形成される。微細穴1Cの配置、 数、大きさ、凹部IDの大きさは、ICI0のサイズに より変更される。尚、図3における微細穴1Cを、焼結 金属を応用した多孔吸着プレートを代用しても、この発 明の請求の範囲を逸脱するものでない。

[0030]

【発明の効果】との発明は、吸着ヘッドのIC吸着面の 中心にICのチップを逃げる凹部と、凹部の周囲であり ICと当接する底面に複数の微細穴を形成し、微細穴を 吸着ブロックの吸着口と接続しているので、上面にチッ プの露出するBGA形ICを吸着し、ICソケットに押 しつけることでICテスタで測定できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明による吸着ハンドの一実施の形態によ 30 る構成図である。

【図2】この発明による吸着ヘッドとICの外観図であ

【図3】との発明による吸着ヘッドの吸着面からの外観 図である。

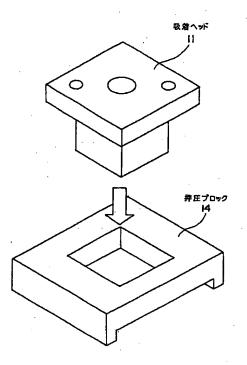
【図4】従来の吸着ハンドの構造図である。

【図5】図4の吸着ヘッド11と押圧プロック14の斜 視図である。

【符号の説明】

- 1 吸着ヘッド
- 1 B 底面
- 10 微細穴
- 1 D 凹部
- 1E 吸着パッド
- 2 吸着ブロック
- 2 A 吸着口
- 3 ハンドベース
- 5 圧縮コイルばね
- 6 リニアガイド

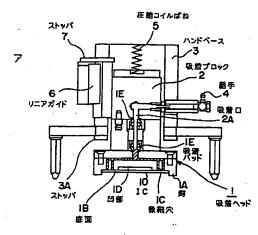
【図5】

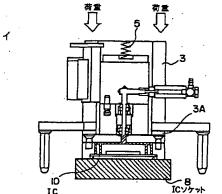


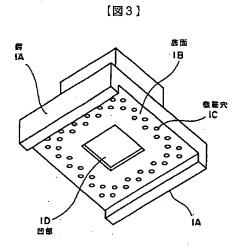
8 ICソケット 10 BGA形IC

*10A チップ

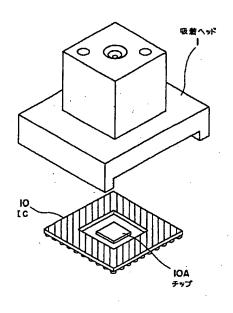
【図1】



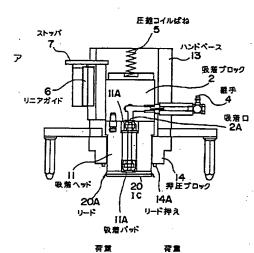


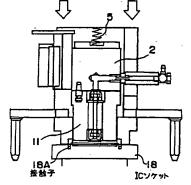


【図2】



【図4】





[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

18.08.2003

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-239362

(43)公開日 平成7年(1995)9月12日

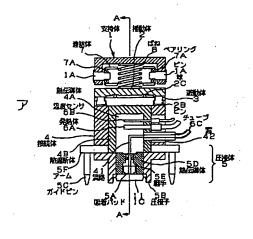
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ						技術表示箇所
G01R 31/26	J								
	Z								
B 2 5 J 15/06	Н		*						
H01L 21/66	G	7630-4M							
21/68	В								•
		審査請求	未請求	請求項	の数 5	FD	(全	7 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号	特願平6-54585		(71) }	出願人		744 (気株式	会社		
22)出願日 平成6年(1994)2月28日		東京都大田区蒲田4丁目19番7号					番7号		
•			(72)発明者 三井 整						
				東京都	大田区	蒲田4	丁目19	番7号 安藤電	
					気株式	会社内			
						•			
•									

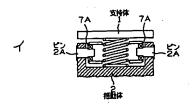
(54) 【発明の名称】 浮動機構つき吸着ハンドおよび搬送接触機構

(57)【要約】

【目的】 オートハンドラとテストヘッドを容易に接続するとともに、ICをICソケットに精度良く接触する機構の提供を目的とする。

【構成】 吸着ハンドは支持体1と揺動体2と遊動体3と接続体4と圧接体5で構成され、圧接体5を浮動状態で保持する。圧接体5を吸着バッド5Aと圧接子5Bをガイドピン5Cで一体に構成する。吸着ハンドは吸着バッド5AでIC11を吸着した状態で、ICソケット21に向け降下する。ガイドピン5Cがガイド22に入ることにより、IC11とICソケット21が正確に位置合わせされ、圧接子5BはIC11のリードをICソケット21の接触子に圧接する。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 テストヘッドの上面に I Cソケット(21) を配置し、オートハンドラを前記テストヘッドに覆う形 で接続し、吸着ハンドはIC(11)を搬送してICソケッ ト(21) に圧接する接続機構において、

吸着ハンドは支持体(1) と、揺動体(2) と、遊動体(3) と、接続体(4) と、圧接体(5) とで構成し、

支持体(1) の下に揺動体(2) を微小揺動可能に連結し、 揺動体(2) は遊動体(3) を微小遊動可能に懸架し、

遊動体(3) は接続体(4) を固定し、

接続体(4) は圧接体(5) を着脱自在に保持し、

圧接体(5) の下面中央部に IC(11)を吸脱着する吸着バ ッド(5A)を配置し、

吸着パッド(5A)の周囲に底面が I C (11)のリードに接触 する圧接子(5B)を設け、

圧接体(5)の側面に張り出す形で少なくとも2つのガイ ドピン(5C)を下向きに突出させ、

ICソケット(21)の周囲にガイドビン(5C)がはいる穴(2 2A) をもつガイド(22)を配置し、

昇降手段(31)は吸着ハンドを降下し、IC(11)を前記 I 20 Cソケット(21)に圧接することを特徴とする浮動機構つ き吸着ハンド。

【請求項2】 接続体(4) の内部に発熱体(6A)により加 熱される第1の熱伝導体(4A)を設け、接続体(4) の周壁 および上壁と第1の熱伝導体(4A)とを熱遮断体(4B)で断 熱支持し、吸着パッド(5A)と熱伝導しない形で第2の熱 伝導体(5D)を圧接子(5B)内に保持し、第1の熱伝導体(4 A)の下面と第2の熱伝導体(5D)の上面は密着し、第2の 熱伝導体(5D)の下面と IC (11)のパッケージを密着させ て加熱することを特徴とする請求項1記載の浮動機構つ 30 き吸着ハンド。

【請求項3】 請求項1または請求項2記載の吸着ハン ドを複数列配置し、複数個のIC(11)を搬送することを 特徴とする浮動機構つき吸着ハンドの搬送機構。

【請求項4】 【Cソケット(21)とガイド(22)を一体に して測定基板(20)上に配置し、請求項1または請求項2 記載の吸着ハンド(10)で【C(11)を【Cソケット(21)に 接触させることを特徴とする浮動機構つき吸着ハンドの 接触機構。

【請求項5】 ガイド(22)が配置される案内基板(23)を 40 オートハンドラの測定部底面に遊動可能に保持し、案内 基板(23)にICソケット(21)の外形で位置を規制する段 付き穴(23A)を設け、請求項1または請求項2記載の吸 着ハンドで【C(11)を【Cソケット(21)に接触させると とを特徴とする浮動機構つき吸着ハンドの接触機構。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】との発明は、浮動機構つき吸着ハ ンドおよび搬送接触機構についてのものである。吸着ハ ンドはオートハンドラに使用され、測定周波数の高い! Cを測定するため、吸着ハンドに保持されたICをIC ソケットに直接圧接する。

[0002]

【従来の技術】次に、従来技術による吸着ハンドおよび 搬送接触機構の構成を図5により説明説明する。図5 は、オートハンドラが I Cテスタのテストヘッドを覆う 形で接続された状態での断面図である。図5の20はテ ストヘッドの上面に配置された測定基板であり、測定基 板20上には板状のアダプタ20Cが取り付けられる。

10 アダプタ20C上には、ICソケット21AとICソケ ット21 Bが一定の間隔で配置される。

【0003】図5の90はオートハンドラの測定部に基 底となる基板であり、基板90上には遊動基板9が設置 される。遊動基板9はベアリング9Bを仲介して基板9 0上に載置されているので、基板90上を自在に移動で きる。遊動基板9の中央下部には、凹字上のケース91 が基板90から突出する形で取り付けられる。ケース9 1の底面には案内基板92Aと案内基板92Bが取り付 けられる。

【0004】案内基板92A・92Bにはそれぞれ段付 き穴920・920があけられ、段付き穴920と段付 き穴92DはICソケット21A・21Bと同じ間隔で ケース91上に配置される。図5では、段付き穴920 ・92Dの段部がICソケット21の外形に案内され、 測定基板20と遊動基板9の位置関係が決定できる。

【0005】遊動基板9の縁部にはクランプレバー9A の固定ねじ部が入る貫通穴があけられ、前記貫通穴の内 径は前記固定ねじ部の外径より十分大きくなっている。 したがって、前述の位置関係が決定した後、クランプレ バー9Aで遊動基板9を基板90に固定する。このよう にして、オートハンドラとテストへッドを接続する。

【0006】遊動基板9上には、リニアガイドで連結さ れる水平移動基板10Fが載置される。水平移動基板1 OF上には台10Gが取り付けられ、台10Gには保持 プロック10Hが移動可能に保持される。シリンダ10 Jが駆動すると、保持ブロック10Hは昇降する。保持 ブロック10Hは吸着ハンド10A・10Bを段付き穴 92C・92Dと同じ間隔で取り付ける。

【0007】吸着ハンド10A・10Bは下部にICを 吸着する吸着パッドを内蔵する。図5の状態から、シリ ンダ10」が吸着ハンド10A・10Bが降下すると、 圧接部10C・10DがICのリードをICソケット2 1 A · 2 1 Bの接触子に圧接する。

【0008】次に、図5の動作を図6により説明する。 図6は図5の上面図であり、オートハンドラの搬送機構 を概略的に示したものである。図6の60は遊動基板9 に載置される供給ステージ、70は基板90に載置され る収容ステージである。供給ステージ60にはICの姿 勢を案内する凹部61Aと凹部61Bが形成される。収 50 容ステージ70にはICの姿勢を案内する凹部71Aと

凹部71Bが形成される。凹部61Aと凹部61Bおよ び凹部71Aと凹部71Bの中心間隔は、ICソケット 21AとICソケット21Bの中心間隔と同じに設定さ

【0009】図6では、図示されないハンドにより凹部 61A・61BにICが搬送される。次に、吸着ハンド 10A・10Bは供給ステージ60上に移動し、ICを 吸着する。次に、吸着ハンド10A・10BはICソケ ット21A・21B上に移動し、ICをICソケット2 1A・21Bに圧接し、測定する。測定が終了すると、 吸着ハンド10A・10BはICを脱着して移動する。 ICソケット21A・21B上に残されたICは、吸着 ハンド10A・10Bとは別のハンドで凹部71A・7 1 Bに搬送される。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】図5および図6に示さ れた吸着ハンドおよび搬送接触機構は、吸着ハンドに保 持されたICをICソケットに直接圧接するので、測定 周波数の高いICを測定する場合に適合している。しか し、近年のQFP型ICのようにリード間隔が極端に狭 20 く、リード幅が細く軟弱なICでは従来の機構では接続 ・搬送が困難になる。

【0011】特に、図6に示される2個並列測定用のオ ートハンドラでは、2つの1Cソケットの中心間隔に合 わせてオートハンドラとテストヘッドを精度良く接続、 またはオートハンドラ内では2つの I Cを精度良く搬送 しなければならない。図5の構造では組立精度または部 品精度を向上しても限界があり、さらに接続に時間がか かるという問題もある。

【0012】との発明は、吸着ハンドに遊動可能に保持 30 される圧接体を設け、圧接体にガイドピンを形成し、1 Cソケットにガイドピンで位置決めされるガイドを形成 することにより、接続容易な浮動機構つき吸着ハンドお よび搬送接触機構の提供を目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するた め、第1の発明は、テストヘッドの上面に I C ソケット 21を配置し、オートハンドラを前記テストヘッドに覆 う形で接続し、吸着ハンドはIC11を搬送してICソ ケット21に圧接する接続機構において、吸着ハンドは 40 支持体1と、揺動体2と、遊動体3と、接続体4と、圧 接体5とで構成し、支持体1の下に揺動体2を微小揺動 可能に連結し、揺動体2は遊動体3を微小遊動可能に懸 架し、遊動体3は接続体4を固定し、接続体4は圧接体 5を着脱自在に保持し、圧接体5の下面中央部に IC1 1を吸脱着する吸着パッド5Aを配置し、吸着パッド5 Aの周囲に底面がICllのリードに接触する圧接子5 Bを設け、圧接体5の側面に張り出す形で少なくとも2 つのガイドピン5Cを下向きに突出させ、ICソケット 21の周囲にガイドビン5 Cがはいる穴22Aをもつガ 50 体7は支持体1内部に配置され、連結体7の第1の側面

イド22を配置し、昇降手段31は吸着ハンドを降下 し、「C11を前記ICソケット21に圧接する。

【0014】第2の発明は、接続体4の内部に発熱体6 Aにより加熱される熱伝導体4Aを設け、接続体4の周 壁および上壁と熱伝導体4Aとを熱遮断体4Bで断熱支 持し、吸着パッド5Aと熱伝導しない形で熱伝導体5D を圧接子5B内に保持し、熱伝導体4Aの下面と熱伝導 体5Dの上面は密着し、熱伝導体5Dの下面とICll のパッケージを密着させて加熱する。

【0015】第3の発明は、第1の発明または第2の発 明の吸着ハンドを複数列配置し、複数個のIC11を搬 送する。

[0016]

【作用】第1の発明による構成によれば、支持体1と揺 動体2は連結体7で回転可能に連結しているのでX軸ま たはY軸を中心に微小揺動する。また、支持体1と揺動 体2は、ばね8で結合され、揺動体2が変位すると、ば ね8は揺動体2を初期状態に復帰する力が働く。揺動体 2と遊動体3は面対偶であり、揺動体2と遊動体3間に 球2Cが介在することにより摩擦係数を小さくしてい る。揺動体2は、遊動体3を段付きピン2Bで遊動可能 に結合する。前述のように圧接体5は浮動状態で保持さ れているので、この吸着ハンドを降下すると、ガイドピ ン5 Cの先端部は円錐状に形成されているので、ガイド 22の穴22Aに馴染み、IC11のリードとICソケ ット21の接触子が精度良く位置合わせされ接触する。 【0017】第2の発明は、第1の発明による浮動機構 つき吸着ハンドの加熱機能を付加したものである。第2 の発明では、IC11を吸着ハンドで吸着中または圧接 中にIC11が加熱されるので、発熱体6Aを適正に温 度制御すれば、温度精度の良い高温測定ができる。ま た、発熱体6Aを使用しないときは、第1の発明による 常温用のオートハンドラとして機能する。

【0018】第3の発明は、第1の発明による吸着ハン ドまたは第2の発明による吸着ハンドを2個以上並列に 配置したものである。第1の発明では吸着ハンドはIC ソケットと個々に位置合わせされるので、吸着ハンド間 またはICソケット間の精度良く組み立てる必要がな

[0019]

【実施例】次に、この発明による吸着ハンドの構成を図 1の実施例により説明する。図1アは吸着ハンドの断面 図であり、図1イは図1アのAA矢視部分断面図であ る。図1の1は支持体、2は揺動体、3遊動体、4は接 続体、5は圧接体であり、7は連結体、8はばね、11 はICである。

【0020】図1では、支持体1は断面が逆凹字状に形 成され、支持体1の相対向する側壁には、ピン1Aの先 端が内部に向かい合う形でピン1Aが固定される。連結 に保持されるベアリング7Aを仲介して、ピン1Aと連結体7を回転可能に連結する。

【0021】揺動体2は断面が凹字状に形成され、揺動体2の相対向する側壁には、ピン2Aの先端が内部に向かい合う形でピン2Aが固定される。連結体7はピン1Aによる軸心と直交する第2のに側面ベアリング7Aが保持され、第2の側面に保持されるベアリング7Aを仲介して、ピン2Aと連結体7を回転可能に連結する。

【0022】連結体7の中央部は貫通穴があけられ、前 記貫通穴内に支持体1と揺動体2が互いに離反する力を 10 付与する圧縮コイルばね8が配置される。すなわち、揺 動体2が変位するとばね8は初期状態に復帰する力が働く

【0023】揺動体2の底面の隅縁部には段付きピン2 Bが固定され、遊動体3は段付きピン2Bの段部で懸下され、遊動体3は微小遊動する。揺動体2と遊動体3間には球3Cが介在され、揺動体2と遊動体3の接触による摩擦力を軽減している。

【0024】接続体4は遊動体3に固定され、中空穴が 形成される。接続体4の内部には、発熱体6Aにより加 20 熱される熱伝導体4Aが設けられる。接続体4の周壁お よび上壁と熱伝導体4Aとを熱遮断体4Bは断熱支持す る。熱伝導体4Aは金属材、好ましくはアルミニウムが 使用され、熱遮断体4Bは熱遮断性合成樹脂材、例え ば、エポキシガラス材が使用される。

【0025】熱伝導体4Aには、後述する吸着バッド5 Aの吸着穴に接続する流路41が形成される。流路41 は継ぎ手を介してチューブ6Cが接続され、チューブ6 Cの遠端は真空ポンプなどに接続される。流路41を負 圧にすることにより、吸着バッド5AでIC11を吸着 30 する。熱伝導体4Aには、加熱温度を検出する温度センサ6Bが挿入される。接続体4の1側壁には、発熱体6 Aの接続線と温度センサ6Bの接続線とチューブ6Cが接続されるための窓42が設けられる。

【0026】圧接体5は、吸着パッド5Aと圧接子5Bとガイドピン5Cと熱伝導体5Dと継手5Eとアーム5Fで構成される。圧接体5は前記構成が一体となって接続体4に着脱自在に保持される。IC11の形状が変わると別の圧接体5が接続体4に取り付けられる。

【0027】圧接体5の下面中央部にはIC11を吸脱 40 着する吸着パッド5Aが配置される。吸着パッド5Aの周囲には、底面がIC11のリードに接触する圧接子5Bが設けられる。圧接体5の側面にアーム5Fで張り出す形で、2つのガイドピン5Cが下向きに突出させる。【0028】吸着パッド5Aは、継手5Eにより熱伝導体5Dと熱伝導しない形で保持される。熱伝導体5Dを圧接子5B内に保持し、熱伝導体4Aの下面と熱伝導体5Dの上面は密着し、熱伝導体5Dの下面とIC11のパッケージを密着させて加熱する。吸着パッド5Aと継 ま5Eの中央には吸着穴が貫通し、前即貫通穴が流路450

1に接続し、IC11を吸着する。

【0029】図2は図1の吸着ハンドの外観図である。図1で説明されたように、図2では、支持体1と揺動体2は連結体7で回転可能に連結しているのでX軸またはY軸を中心に微小揺動する。遊動体3と接続45と圧接体5は一体となって、X方向またはY方向に微小移動、あるいはXY平面を微小回転する。

【0030】次に、図1の吸着ハンドを使用した接触機構の第1の実施例を図3により説明する。図3では、測定基板20上の板状のアダプタ20Aが取り付けられる。アダプタ20Aには、ICソケット21が取り付けられ、ICソケット21の周囲には、ガイドピン5Cがはいる穴22Aをもつガイド22が配置される。

【0031】図3では、基板90には供給ステージ16 と収容ステージ17が載置される。供給ステージ16に はIC11の姿勢を案内する凹部16Aが形成される。 凹部16Aの周囲にガイドピン5Cがはいる穴62をも つガイド16Cが配置される。収容ステージ17にはI C11の姿勢を案内する凹部17Aが形成される。

【0032】図3の30は移動体であり、第1の昇降手段であるシリンダ31と第2の昇降手段であるシリンダ32が取り付けられる。シリンダ31はこの発明による吸着ハンド(以下、吸着ハンド10と呼ぶ。)を昇降し、シリンダ32は吸着ハンド32Aを昇降する。モータ33は移動体30を水平方向に移動する。移動体30はシリンダ31・32と吸着ハンド10・32Aを一体にして移動する・

【0033】次に、図3の動作を説明する。吸着ハンド10を供給ステージ16上に移動する。次に、シリンダ31を駆動し、吸着ハンド10は凹部6A内の1C11を吸着する。このとき、圧接体5はガイド16Cにより精度良く位置決めされて、IC11を保持する。次に、吸着ハンド10はICソケット21上に移動し、降下する。このとき、圧接体5はガイド22によりICソケット21と精度良く位置決めされ、IC11が圧接される。IC11の測定が終了すると、IC11をICソケット21に残し、吸着ハンド10は供給ステージ16側に移動する。ICソケット21に残留したIC11は吸着ハンド32Aにより収容ステージ17の凹部17Aに搬送される。

【0034】次に、図1の吸着ハンドを使用した接触機構の第2の実施例を図4により説明する。オートハンドラとテストヘッドの接続機構では、テストヘッドの構成により、図3のようにガイド22を測定基板20上に配置できない場合がある。図4は、このような場合も接続可能とした実施例である。

圧接子5B内に保持し、熱伝導体4Aの下面と熱伝導体 5Dの上面は密着し、熱伝導体5Dの下面とIC11の パッケージを密着させて加熱する。吸着パッド5Aと維 50 ト21の外形より微小大きく形成されているので、段付 き穴23AでICソケット21の外形を規制することができる。

【0036】段付き穴23Aの周囲には、ガイドビン5 Cがはいる穴22Aをもつガイド22が配置される。案 内基板23の縁部にはピン23Bが立設する。ピン23 Bは、測定部の基板90の開口部に延設された接続板2 3Cと遊動可能に連結する。圧縮コイルばね23Dはピン23Bに介挿され、案内基板23と接続板23Cが離 反する方向に力を付与する。

【0037】図4では、基板90の水平面に対し、測定 10 基板20が微小角度傾いていても案内基板23が遊動可能に弾性的に保持されているので、ICソケット21が段付き穴23Aに容易に挿入できる。さらに、圧接体5が浮動するので、IC11はガイド22Aに案内され、精度良くICソケット21に接触する。

【0038】図3と図4による接触機構の実施例では、 吸着ハンド10を単体で使用する例を示したが、図3お よび図4では吸着ハンド10を複数使用する複数個並列 測定が可能である。

[0039]

【発明の効果】この発明は、吸着ハンドに遊動可能に保持される圧接体を設け、圧接体にガイドビンを形成し、 ICソケットにガイドビンで位置決めされるガイドを形成するので、テストヘッドとオートハンドラの接続が容易になる。また、この発明の吸着ハンドは吸着パッドと圧接子を一体にしているので、ICをICソケットに圧接するとき、ICのリード曲りを軽減できる。

【図面の簡単な説明】

*【図1】との発明による吸着ハンドの構成図である。

【図2】図1の吸着ハンドの外観図である。

【図3】図1の吸着ハンドを使用した接触機構の第1の 実施例による図である。

【図4】図1の吸着ハンドを使用した接触機構の第2の 実施例による図である。

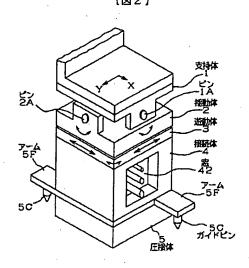
【図5】従来技術による吸着ハンドおよび搬送接触機構 の構成図である。

【図6】図5の上面図である。

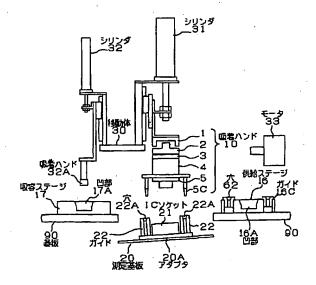
10 【符号の説明】

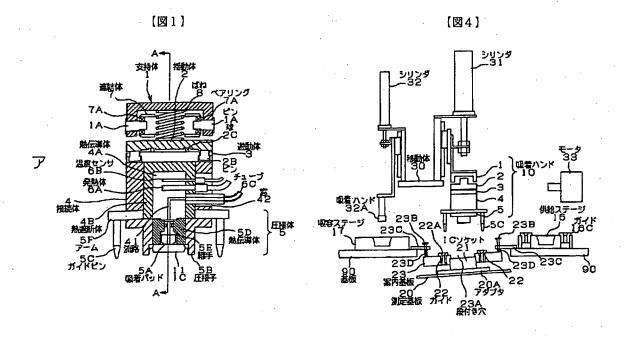
- 1 支持体
- 2 揺動体
- 3 遊動体
- 4 接続体
- 4A 熱伝導体
- 4 B 熱遮断体
- 5 圧接体
- 5A 吸着パッド
- 5 B 圧接子
- 20 5C ガイドピン
 - 5 D 熱伝導体
 - 6 A 発熱体
 - 11 IC
 - 21 ICソケット
 - 22 ガイド
 - 23 案内基板
 - 23A 段付き穴

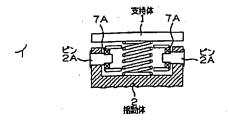
[図2]

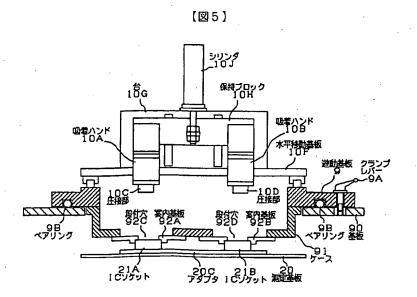


【図3】

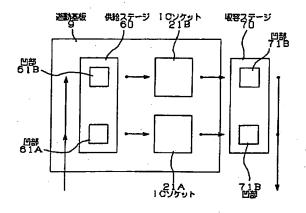








【図6】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁶

識別記号 广内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 5 K 13/04

Z

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第1区分 【発行日】平成12年12月15日(2000.12.15)

【公開番号】特開平7-239362

【公開日】平成7年9月12日(1995.9.12)

【年通号数】公開特許公報7-2394

【出願番号】特願平6-54585

【国際特許分類第7版】

G01R 31/26

B25J 15/06

H01L 21/66

21/68

H05K 13/04

[FI]

G01R 31/26

7

B253 15/06

н

H01L 21/66

Н

21/68

00

H05K 13/04

【手続補正書】

【提出日】平成11年6月2日(1999.6.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0021

【補正方法】変更

【補正内容】

【0021】揺動体2は断面が凹字状に形成され、揺動体2の相対向する側壁には、ピン2Aの先端が内部に向かい合う形でピン2Aが固定される。連結体7はピン1Aによる軸心と直交する第2のに側面ベアリング7Aが保持され、第2の側面に保持されるベアリング7Aを仲介して、ピン2Aと連結体7を回転可能に連結する。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0029

【補正方法】変更

【補正内容】

【0029】図2は図1の吸着ハンドの外観図である。図1で説明されたように、図2では、支持体1と揺動体2は連結体7で回転可能に連結しているのでX軸またはY軸を中心に微小揺動する。遊動体3と接続体4と圧接体5は一体となって、X方向またはY方向に微小移動、あるいはXY平面を微小回転する。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0033

【補正方法】変更

【補正内容】

【0033】次に、図3の動作を説明する。吸着ハンド10を供給ステージ16上に移動する。次に、シリンダ31を駆動し、吸着ハンド10は凹部16A内のIC11を吸着する。このとき、圧接体5はガイド16Cにより精度良く位置決めされて、IC11を保持する。次に、吸着ハンド10はICソケット21上に移動し、降下する。このとき、圧接体5はガイド22によりICソケット21と精度良く位置決めされ、IC11が圧接される。IC11の測定が終了すると、IC11をICソケット21に残し、吸着ハンド10は供給ステージ16側に移動する。ICソケット21に残留したIC11は吸着ハンド32Aにより収容ステージ17の凹部17Aに搬送される。

【手続補正4】

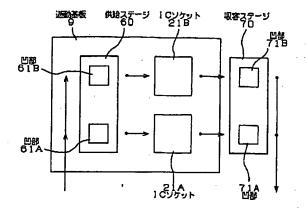
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図6

【補正方法】変更

【補正内容】

【図6】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED FEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.